

Sujet : Suppression de la table 2 a.c (electrical measurements at room température ac parameters) et table 3 (électrical measurement a high and low temperatures)

Notre analyse porte sur deux transistors représentatifs de notre famille de produit : le 2N2222A de type npn et le 2N2907A de type pnp.

Une analyse a été faite sur 3 lots pilotes par type de transistors provenant : de lot de diffusion différent
:de serie de diffusion different

Annexe1

<u>2N2222A</u>		50 pieces/ lp (soit 150 pieces)		
N° LP	N° LOT DE DIFFUSION	N° WAFER	N° de PSL	Qte de pieces assemblées
653	4.9614.001	210874	10512 à 12529	11953
704	4.9721.001	216348	13593 à 14345	15025
861	4.9649.001	215454	12960 à 15003	8543
<u>2N2907A</u>		50 pieces/ lp (soit 150 pieces)		
N° LP	N° LOT DE DIFFUSION	N° WAFER	N° de PSL	Qte de pieces assemblées
640	4.9440.002	206144	10374 à 10400	10380
719	4.9648.001	214705	15066 à 14564	9887
724	4.9724.007	216461	13132 à 14599	7539

Une analyse a également été faite sur les mesures effectuées des lots clients issus de ces wafers de ces mêmes lots de diffusion et comparé aux résultats des lots pilotes(annexe 2)

annexe 2

*le tableau résume les tests conformes à la spec de détail ESCC
Les valeurs entre parenthese sont celles des lots pilotes*

Conclusion :

Les résultats nous montrent que les mesures effectuées sur les lots pilotes sont représentatives des mesures effectuées sur les lots clients et qu'il n'y a aucune dérive significative.

De ce fait ST propose de supprimer les Read and Record Table 2 AC et Table 3 high and low température, et de spécifier que ces paramètres sont déjà mesurés au cours du lot de qualification de chaque wafer. Ceci fera l'objet d'un appendice commun dans chaque spécification de détail. Voir proposition de la DCR jointe.